

112 年度工研院技術移轉與法律中心無線通訊、光電半導體、

節能環保、機械自動化及其他等相關研發成果非專屬授權案

- 一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。
- 二、非專屬授權標的：本案授權標的包含研發成果專利 213 案 348 件。詳細資訊請參「附件：授權標的清單」。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
 - （一）舉辦時間：民國（下同）112 年 3 月 30 日下午 2 時至 3 時。
 - （二）舉辦地點：線上公開說明會。
 - （三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 3 月 29 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「112 年度工研院技術移轉與法律中心無線通訊、光電半導體、節能環保、機械自動化及其他等相關研發成果非專屬授權案公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 3 月 29 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- 五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 黃小姐

電話：+886-3-591-4364

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：yt.huang@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：授權標的清單

(一) 無線通訊：24 案 41 件。

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
1	1	P07100010TW	視線追蹤方法及應用其之視線追蹤裝置	中華民國	審查中	110147911			
	2	P07100010US	視線追蹤方法及應用其之視線追蹤裝置	美國	審查中	17/562,652			
2	3	P27100002US	基於感測資料調整休眠時間的方法及電子裝置	美國	審查中	17/705,386			
3	4	P51100037US	嵌入式系統以及振動驅動方法	美國	審查中	17/857,044			
4	5	P51110007CN	資訊顯示方法及其處理裝置與資訊顯示系統	中國大陸	審查中	202211252575.3			
	6	P51110007TW	資訊顯示方法及其資訊顯示系統與處理裝置	中華民國	審查中	111130006			
	7	P51110007US	基於分散式運算之跨裝置虛實融合顯示技術方法	美國	審查中	17/979,785			
5	8	P51110009CN	信息顯示方法及其處理裝置與信息顯示系統	中國大陸	審查中	202210997341.5			
	9	P51110009TW	資訊顯示方法及其處理裝置與資訊顯示系統	中華民國	審查中	111128679			
	10	P51110009US	資訊顯示方法及其處理裝置與資訊顯示系統	美國	審查中	17/939,900			
6	11	P51110014CN	信息顯示方法及其處理裝置與信息顯示系統	中國大陸	審查中	202211376755.2			
	12	P51110014TW	資訊顯示方法及其處理裝置與資訊顯示系統	中華民國	審查中	111137134			
	13	P51110014US	資訊顯示方法及其處理裝置與資訊顯示系統	美國	審查中	17/984,220			
7	14	P51110023TW	定位裝置以及載具的定位方法	中華民國	審查中	111141399			
8	15	P51110024CN	加速典型多元分解的電子裝置和方法	中國大陸	審查中	202211368828.3			
	16	P51110024TW	加速典範多元分解的電子裝置和方法	中華民國	審查中	111134795			
	17	P51110024US	加速典範多元分解的電子裝置和方法	美國	審查中	18/077,126			
9	18	P51110028US	物件檢測方法、物件檢測設備以及其非暫時性儲存媒體	美國	審查中	17/993,881			
10	19	P51110030CN	透光天線	中國大陸	審查中	202211391453.2			
	20	P51110030TW	透光天線	中華民國	審查中	111137587			
	21	P51110030US	透光天線	美國	審查中	17/984,214			
11	22	P51110031CN	透光天線	中國大陸	審查中	202211369420.8			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
	23	P51110031TW	透光天線	中華民國	審查中	111138298			
12	24	P51110034TW	異質感測器動態校準系統及異質感測器動態校準方法	中華民國	審查中	111141400			
13	25	P51110042TW	電池健康度計算方法及裝置	中華民國	審查中	111142229			
14	26	P51110043TW	充電裝置控制方法及充電系統	中華民國	審查中	111142237			
15	27	P51110045TW	硬體感知零成本神經網路架構搜尋系統及其網路潛力評估方法	中華民國	審查中	111141975			
16	28	P51110047TW	電池盒	中華民國	審查中	111212995			
17	29	P51110049TW	聲學事件的資料處理方法	中華民國	審查中	111145534			
18	30	P52100002US	壓控振盪裝置	美國	審查中	17/886,143			
19	31	P52100049CN	人工智能加速器及其運作方法	中國大陸	審查中	202211572402.X			
	32	P52100049TW	人工智慧加速器及其運作方法	中華民國	審查中	111142811			
20	33	P53110011TW	目標追蹤系統及應用其之目標追蹤方法	中華民國	審查中	111140408			
21	34	P53110035TW	設備服務數據防竄改方法及其系統	中華民國	審查中	111144472			
22	35	P65110009TW	身分確認的方法	中華民國	審查中	111148856			
	36	P65110009US	身分確認的方法	美國	審查中	18/085,057			
23	37	P65110012TW	資料處理系統及其方法	中華民國	審查中	111148017			
	38	P65110012US	資料處理系統及其方法	美國	審查中	18/080,855			
24	39	P68100012CN	工藝診斷系統及其操作方法	中國大陸	審查中	202111504878.5			
	40	P68100012TW	製程診斷系統及其操作方法	中華民國	審查中	110144592			
	41	P68100012US	製程診斷系統及其操作方法	美國	審查中	17/562,852			

(二) 光電半導體：43 案 69 件。

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
1	1	P07080008TW	光學量測系統	中華民國	獲證	109115426	TWI733442	20210711	20400507
	2	P07080008US	光學量測系統	美國	審查中	17/028,012			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
2	3	P07080009USC1	用於檢測平面基板上之三維奈米結構的 X 光反射儀與其方法	美國	審查中	17/532,767			
3	4	P07090006TW	檢測裝置及發光二極體的檢測方法	中華民國	獲證	110100076	TWI773068	20220801	20410103
	5	P07090006US	檢測裝置及發光二極體的檢測方法	美國	審查中	17/135,874			
4	6	P07100014TW	發光二極體晶粒的檢測裝置及檢測方法	中華民國	審查中	111125797			
	7	P07100014US	發光二極體晶粒的檢測裝置及檢測方法	美國	審查中	18/075,431			
5	8	P07110007TW	電子看板分眾行銷方法	中華民國	審查中	111146367			
6	9	P27100001TW	光學參數自動設定方法及應用其之自動光學檢測系統	中華民國	審查中	110115481			
	10	P27100001US	光學參數自動設定方法及應用其之自動光學檢測系統	美國	審查中	17/243,798			
7	11	P51070026USD2	顯示陣列的製造方法	美國	審查中	17/974,531			
8	12	P51080050USD1	畫素結構及其製造方法、以及具有此種畫素結構的顯示器	美國	審查中	17/879,793			
9	13	P51100023JPC1	具有平衡應力的半導體基板	日本	審查中	2022-170543			
	14	P51100023TWC1	具有平衡應力的半導體基板	中華民國	審查中	111138824			
	15	P51100023USC1	具有平衡應力的半導體基板	美國	審查中	17/994,403			
10	16	P51100044TWC1	電子封裝體及電子封裝體的製造方法	中華民國	審查中	111140022			
11	17	P51100045TWC1	眼鏡上的頭戴式擴增實境立體視覺光學膜	中華民國	審查中	111145301			
12	18	P51100048CN	具對位標記之電子裝置	中國大陸	審查中	202210877008.0			
	19	P51100048US	具對位標記之電子裝置	美國	審查中	17/886,333			
13	20	P51100059CN	多模感知協同訓練系統及多模感知協同訓練方法	中國大陸	審查中	202211326934.5			
	21	P51100059TW	多模感知協同訓練系統及多模感知協同訓練方法	中華民國	審查中	111134592			
	22	P51100059US	多模感知協同訓練系統及多模感知協同訓練方法	美國	審查中	17/975,628			
14	23	P51100062US	透明顯示器、透明膜片與透明裝置	美國	審查中	17/886,222			
15	24	P51100063US	光源模組	美國	審查中	17/858,085			
16	25	P51100064US	浮空影像顯示裝置	美國	審查中	17/865,421			
17	26	P51110001CN	光學穿透式顯示器的校正方法與校正系統	中國大陸	審查中	202211583168.0			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
	27	P51110001TW	光學穿透式顯示器的校正方法與校正系統	中華民國	審查中	111143809			
18	28	P51110002CN	具有感測放大器校準機制的存儲電路	中國大陸	審查中	202211599841.X			
	29	P51110002TW	具有感測放大器校準機制的儲存電路	中華民國	審查中	111147555			
	30	P51110002US	具有感測放大器校準機制的儲存電路	美國	審查中	18/074,528			
19	31	P51110003US	聲音訊號的分析方法及裝置、晶片的設計方法及裝置	美國	審查中	17/850,906			
20	32	P51110013CN	存儲單元	中國大陸	審查中	202211357664.4			
	33	P51110013TW	記憶體單元	中華民國	審查中	111133890			
	34	P51110013US	記憶體單元	美國	審查中	17/983,331			
21	35	P51110016CN	先進電路設計方法及裝置	中國大陸	審查中	202211512039.2			
	36	P51110016TW	先進電路設計方法及裝置	中華民國	審查中	111138615			
22	37	P51110017TW	模組裝置	中華民國	審查中	111210335			
	38	P51110017TWA1	模組裝置	中華民國	審查中	111135966			
23	39	P51110019CN	封裝結構	中國大陸	審查中	202211364592.6			
	40	P51110019TW	封裝結構	中華民國	審查中	111133561			
24	41	P51110020TW	光學元件	中華民國	審查中	111143816			
	42	P51110020US	光學元件	美國	審查中	18/070,413			
25	43	P51110022TW	電源設計架構	中華民國	審查中	111139712			
26	44	P51110026TW	生理感測裝置	中華民國	審查中	111139315			
27	45	P51110027TW	耦合式生理訊號量測裝置	中華民國	審查中	111140287			
28	46	P51110029TW	用於偵測三相交流電源的異常偵測電路	中華民國	審查中	111139913			
	47	P51110029US	用於偵測三相交流電源的異常偵測電路	美國	審查中	18/077,147			
29	48	P51110033CN	量測卡、量測系統及量測方法	中國大陸	審查中	202211495334.1			
	49	P51110033TW	量測卡、應用其之量測系統及量測方法	中華民國	審查中	111137291			
30	50	P51110036JP	色轉換面板與顯示器	日本	審查中	2022-198658			
	51	P51110036TW	色轉換面板與顯示器	中華民國	審查中	111141246			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
	52	P51110036US	色轉換面板與顯示器	美國	審查中	18/082,540			
31	53	P51110037TW	顯示器元件與投影器	中華民國	審查中	111138908			
	54	P51110037US	顯示器元件與投影器	美國	審查中	18/081,700			
32	55	P51110038TW	功率模組	中華民國	審查中	111143376			
33	56	P51110039TW	顯示裝置	中華民國	審查中	111148435			
34	57	P51110050CN	晶體管結構及其製造方法	中國大陸	審查中	202211414098.6			
	58	P51110050TW	電晶體結構及其製造方法	中華民國	審查中	111141794			
35	59	P51110053TW	半導體元件	中華民國	審查中	111142548			
36	60	P51110054TW	晶片封裝結構及其製作方法	中華民國	審查中	111144711			
37	61	P51110061TW	開關電路及可程式連接晶片	中華民國	審查中	111146556			
38	62	P51110063US	磁性記憶體結構	美國	審查中	18/081,698			
39	63	P51110064TW	用於計算遮蔽人臉影像的人臉擺動方向的裝置及方法	中華民國	審查中	111146885			
40	64	P51110065TW	磁性隨機存取記憶體結構	中華民國	審查中	111145782			
41	65	P51110072TW	量子裝置與微波裝置	中華民國	審查中	111147188			
42	66	P55110022CN	一種混合式分佈式光纖感測系統	中國大陸	審查中	202211539925.4			
	67	P55110022JP	一種混合布里淵光時域分析法與相位靈敏光時域反射法之分佈式光纖感測系統	日本	審查中	2022-193657			
	68	P55110022TW	一種混合布里淵光時域分析法與相位靈敏光時域反射法之分佈式光纖感測系統	中華民國	審查中	111146364			
43	69	P70100007TW	晶圓片材的加工方法和加工系統以及應用加工方法形成之晶圓片材	中華民國	審查中	110148197			

(三) 節能環保：35 案 54 件。

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
1	1	P07070002TW	太陽光電系統	中華民國	獲證	107134904	TWI670928	20190901	20381002
2	2	P07090001TW	太陽光電移動實驗室	中華民國	獲證	110100472	TWI767502	20220611	20410105

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
	3	P07090001US	太陽光電移動實驗室	美國	獲證	17/132,386	US11356056	20220607	20401222
3	4	P07100005CN	量測方法	中國大陸	審查中	202210022330.5			
	5	P07100005TW	量測方法	中華民國	審查中	110138960			
	6	P07100005US	量測方法	美國	審查中	17/542,504			
4	7	P07110003TW	電池檢測方法及裝置	中華民國	審查中	111137594			
5	8	P07110008TW	髒污偵測模組、自動潔淨模組、偵污自潔裝置及應用其之方法	中華民國	審查中	111146369			
6	9	P30100002TW	移動式太陽能發電機構	中華民國	獲證	110209987	M620708	20211201	20310823
7	10	P51110032TW	光電發電系統	中華民國	審查中	111211104			
8	11	P54100023CN	水質監測裝置及其監測方法	中國大陸	審查中	202111599472.X			
	12	P54100023TW	水質監測裝置及其監測方法	中華民國	審查中	110148661			
	13	P54100023US	水質監測裝置及其監測方法	美國	審查中	17/561,729			
9	14	P55100001CN	臭氧產生裝置以及臭氧產生方法	中國大陸	審查中	202210776338.0			
	15	P55100001US	臭氧產生裝置以及臭氧產生方法	美國	審查中	17/861,078			
10	16	P55100006JP	散熱系統	日本	審查中	2021-214763			
	17	P55100006TW	散熱系統	中華民國	審查中	110149065			
	18	P55100006TWA1	散熱系統	中華民國	審查中	110149066			
11	19	P55100008CN	氧化芳香族揮發性有機化合物的催化劑與方法	中國大陸	審查中	202111352664.0			
	20	P55100008TW	氧化芳香族揮發性有機化合物的觸媒與方法	中華民國	審查中	110139837			
12	21	P55100009CN	電能分配系統	中國大陸	審查中	202111625517.6			
	22	P55100009TW	電能分配系統	中華民國	審查中	110147626			
13	23	P55100013TW	正滲透濃縮裝置與濃縮方法	中華民國	審查中	110148366			
14	24	P55100015TWC1	局部穿隧氧化層鈍化接觸太陽能電池及其製造方法	中華民國	審查中	111143380			
15	25	P55100016US	渦輪裝置及循環系統	美國	審查中	17/892,349			
16	26	P55100020MY	纖維素分解菌劑、短小芽孢桿菌之醱酵產物及製備方法、以及促進沼氣產量之方法	馬來西亞	審查中	PI2022006767			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
17	27	P55110001TW	線性驅動模組	中華民國	審查中	111146019			
	28	P55110001US	線性驅動模組	美國	審查中	18/078,347			
18	29	P55110002CN	混合變壓裝置及其控制方法	中國大陸	審查中	202211237279.6			
	30	P55110002TW	混合變壓裝置及其控制方法	中華民國	審查中	111135384			
19	31	P55110005TW	用於電源轉換設備的控制裝置	中華民國	審查中	111147823			
20	32	P55110008TW	變頻器冷媒冷卻控制方法與變頻器冷媒冷卻迴路	中華民國	審查中	111144099			
21	33	P55110009CN	催化劑氧化處理控制系統及催化劑氧化處理方法	中國大陸	審查中	202211626173.5			
	34	P55110009TW	觸媒氧化處理控制系統	中華民國	審查中	111144956			
22	35	P55110010TW	電壓轉換器	中華民國	審查中	111148066			
	36	P55110010US	電壓轉換器	美國	審查中	18/080,877			
23	37	P55110014TW	多聯式空調設備之溫度控制方法及其系統	中華民國	審查中	111145506			
24	38	P55110016TW	偵測太陽能電池中的熱斑區域的方法	中華民國	審查中	111147147			
25	39	P55110017CN	氧化觸媒與其形成方法與處理煙氣的方法	中國大陸	審查中	202211552602.9			
	40	P55110017TW	氧化觸媒與其形成方法與處理煙氣的方法	中華民國	審查中	111143729			
26	41	P55110018TW	熱箱裝置及其操作方法	中華民國	審查中	111147097			
27	42	P55110021CN	智慧除霜控制系統及其方法	中國大陸	審查中	202211611294.2			
	43	P55110021TW	智慧除霜控制系統及其方法	中華民國	審查中	111147150			
28	44	P55970064MY	氫氣製造裝置	馬來西亞	審查中	PI20091852			
29	45	P57110001TW	太陽能熱泵乾燥系統	中華民國	審查中	111208760			
30	46	P65100003CN	無人航空載具的容器裝置和運輸系統	中國大陸	審查中	202210235942.2			
31	47	P65110002CN	對象材積量測系統及其方法	中國大陸	審查中	202211205663.8			
	48	P65110002TW	物件材積量測系統及其方法	中華民國	審查中	111134955			
32	49	P65110003CN	自走車及校正取物路徑的方法	中國大陸	審查中	202211533403.3			
	50	P65110003TW	自走車及校正取物路徑的方法	中華民國	審查中	111143372			
33	51	P65110004TW	管理倉庫的貨架配置的電子裝置及方法	中華民國	審查中	111148184			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
	52	P65110004US	管理倉庫的貨架配置的電子裝置及方法	美國	審查中	18/081,690			
34	53	P65110008TW	用於跟隨目標物的自走車及其方法	中華民國	審查中	111146511			
35	54	P65110016TW	理貨影像識別系統及應用其之理貨影像識別方法	中華民國	審查中	111148718			

(四) 機械自動化：103 案 173 件。

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
1	1	P07040002JPC1	表面量測裝置及其方法	日本	獲證	2018-164259	JP6783833	20201026	20360822
	2	P07040002JPD1	表面量測裝置及其方法	日本	獲證	2020-094251	JP7041193	20220314	20360821
2	3	P07060004KR	在線監測特殊氣體的顆粒污染之設備	韓國	獲證	10-2018-0121494	KR102156360	20200909	20381011
3	4	P07070008TW	成像方法及成像系統	中華民國	獲證	107144574	TWI682149	20200111	20381210
4	5	P07080002CN	三維量測裝置與其操作方法	中國大陸	審查中	202010022455.9			
	6	P07080002TW	三維量測裝置與其操作方法	中華民國	獲證	108133526	TWI735953	20210811	20390917
	7	P07080002US	三維量測裝置與其操作方法	美國	獲證	16/717,425	US11248903	20220215	20400509
5	8	P07080004EP	被動式基材螢光薄膜厚度檢測裝置及方法	EPC/歐盟	審查中	20171530.7			
	9	P07080004TW	被動式基材螢光薄膜厚度檢測裝置及方法	中華民國	獲證	109108564	TWI761788	20220421	20400315
	10	P07080004US	被動式基材螢光薄膜厚度檢測裝置及方法	美國	獲證	16/730,236	US11287253	20220329	20400417
6	11	P07090003TW	掃描裝置之調校組件與調校系統	中華民國	獲證	110100471	TWI770755	20220711	20410105
	12	P07090003US	掃描裝置之調校組件與調校系統	美國	審查中	17/131,515			
7	13	P07090005TW	機器學習分類模型之修正方法與訓練系統及使用者介面	中華民國	審查中	109138987			
	14	P07090005US	機器學習分類模型之修正方法與訓練系統及使用者介面	美國	審查中	17/115,266			
8	15	P07100001TW	地下水管洩漏檢測系統及方法	中華民國	審查中	110146007			
	16	P07100001US	地下水管洩漏檢測系統及方法	美國	審查中	17/678,918			
9	17	P07100003TW	微流道感測晶片及其量測系統	中華民國	審查中	110138264			
	18	P07100003US	多頻兆赫波微流道感測晶片及量測方法	美國	審查中	17/575,290			
10	19	P07100006TW	軌道量測儀測試裝置	中華民國	獲證	110142172	I778863	20220921	20411111

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
11	20	P07100007KR	用於微影製程的檢測方法與檢測平台	韓國	審查中	10-2022-0034931			
	21	P07100007TW	用於微影製程的檢測方法與檢測平台	中華民國	審查中	110144747			
	22	P07100007US	用於微影製程的檢測方法與檢測平台	美國	審查中	17/676,534			
12	23	P07100008TW	異質整合檢測方法與異質整合檢測裝置	中華民國	審查中	110143061			
	24	P07100008US	異質整合檢測方法與異質整合檢測裝置	美國	審查中	17/562,019			
13	25	P07110001TW	用以量測平整基板上之三維奈米結構的 X 射線反射儀設備及方法	中華民國	審查中	111134541			
	26	P07110001US	用以量測平整基板上之三維奈米結構的 X 射線反射儀設備及方法	美國	審查中	17/994,858			
14	27	P07110002TW	β 2-微球蛋白濃度的分析方法及裝置	中華民國	審查中	111132190			
15	28	P07110005TW	檢測系統以及發光二極體的檢測方法	中華民國	審查中	111137243			
16	29	P07110006TW	兆赫波檢測晶片及兆赫波量測系統	中華民國	審查中	111142843			
17	30	P07110012TW	量測系統及量測方法	中華民國	審查中	111147905			
18	31	P27110001TW	高功率多頻耦合驅動器及其驅動方法	中華民國	審查中	111133411			
19	32	P27110002TW	料帶貼合裝置	中華民國	審查中	111140473			
	33	P27110002US	料帶貼合裝置	美國	審查中	18/077,048			
20	34	P27110003TW	雷射微加工裝置及其方法	中華民國	審查中	111132857			
	35	P27110003US	雷射微加工裝置及其方法	美國	審查中	17/960,756			
21	36	P27110004TW	光學雷達及其光訊號拾取方法	中華民國	審查中	111133560			
	37	P27110004US	光學雷達及其光訊號拾取方法	美國	審查中	18/071,718			
22	38	P27110005TW	電池模組與電池管理系統	中華民國	審查中	111146761			
23	39	P27110006TW	電極結構、充電電池以及電池極耳與導電柄焊接的方法	中華民國	審查中	111141029			
	40	P27110006US	電極結構、充電電池以及電池極耳與導電柄焊接的方法	美國	審查中	18/071,518			
24	41	P27110008TW	雷射自動補償調控裝置、應用其之雷射加工系統及雷射自動補償調控方法	中華民國	審查中	111136757			
	42	P27110008US	雷射自動補償調控裝置、應用其之雷射加工系統及雷射自動補償調控方法	美國	審查中	17/978,829			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
25	43	P27110009TW	電壓轉換裝置及與其相關的電壓轉換方法	中華民國	審查中	111144396			
26	44	P27110011TW	材料改質加工裝置與凹洞成形方法	中華民國	審查中	111146031			
27	45	P27110013TW	銲接方法	中華民國	審查中	111144891			
28	46	P30090001TW	可攜式掃描載架與可攜式多型態掃描儀	中華民國	獲證	109132892	TWI753583	20220121	20400922
29	47	P30100001TW	無人機	中華民國	獲證	110300415	D213360	20210811	20360124
30	48	P30110001TW	連續式雙雷射晶圓厚度與翹曲度量測系統	中華民國	審查中	111140075			
31	49	P51110008TWC1	設備異常檢測方法及裝置	中華民國	審查中	111148853			
32	50	P53100015JP	沉積設備及沉積方法	日本	審查中	2022-093372			
33	51	P53100017US	置換研拋墊的裝置	美國	審查中	17/965,497			
34	52	P53100018US	使用能量束的表面加工設備及表面加工方法	美國	審查中	17/953,338			
35	53	P53100019US	三維電路板及其製作方法以及探針卡	美國	審查中	18/073,561			
36	54	P53110003TW	內視鏡導航方法及系統	中華民國	審查中	111133314			
	55	P53110003US	內視鏡導航方法及系統	美國	審查中	18/071,450			
37	56	P53110004TW	可撓管、驅動其之驅動機構及控制系統以及控制其之控制方法	中華民國	審查中	111135908			
	57	P53110004US	可撓管、驅動其之驅動機構及控制系統以及控制其之控制方法	美國	審查中	17/993,820			
38	58	P53110005TW	沖壓製程之加工曲線的成型方法	中華民國	審查中	111135146			
	59	P53110005US	沖壓製程之加工曲線的成型方法	美國	審查中	17/994,761			
39	60	P53110006TW	自動化流體更換裝置及流體輸送接頭	中華民國	審查中	111132836			
	61	P53110006US	自動化流體更換裝置及流體輸送接頭	美國	審查中	17/975,520			
40	62	P53110007TW	局部加熱裝置及具有其之局部加熱系統	中華民國	審查中	111135358			
	63	P53110007US	局部加熱裝置及具有其之局部加熱系統	美國	審查中	18/076,545			
41	64	P53110008TW	車輛換檔自動裝置與其方法	中華民國	審查中	111141959			
42	65	P53110009TW	判定自駕車的情境資料的電子裝置及方法	中華民國	審查中	111142575			
43	66	P53110013TW	環形整流裝置與方法	中華民國	審查中	111140428			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
	67	P53110013US	環形整流裝置與方法	美國	審查中	18/063,428			
44	68	P53110014TW	碳化矽錠裂片裝置與方法	中華民國	審查中	111142404			
45	69	P53110016TW	壓差產生裝置	中華民國	審查中	111143352			
46	70	P53110018CN	點雲定位偵錯方法及系統	中國大陸	審查中	202211505176.3			
	71	P53110018TW	點雲定位偵錯方法及系統	中華民國	審查中	111143155			
47	72	P53110021TW	加工設備及其承載結構	中華民國	審查中	111145509			
	73	P53110021US	加工設備及其承載結構	美國	審查中	18/059,263			
48	74	P53110023US	基於電流訊號之裝置狀態評估系統及評估方法	美國	審查中	18/064,895			
49	75	P53110024TW	對接結構及包括其之對接裝置	中華民國	審查中	111145478			
	76	P53110024US	對接結構及包括其之對接裝置	美國	審查中	17/994,717			
50	77	P53110026TW	電動車輛之馬達控制器及馬達控制方法	中華民國	審查中	111144820			
51	78	P53110027CN	傳動裝置及其傳動結構的狀態監控方法	中國大陸	審查中	202211632492.7			
	79	P53110027TW	傳動裝置及其傳動結構之狀態監控方法	中華民國	審查中	111146040			
52	80	P53110031CN	車輛煞車輔助裝置與其方法	中國大陸	審查中	202211633410.0			
53	81	P55100021CN	使用狀態觀察器之直交流轉換器系統及其控制方法	中國大陸	審查中	202210381558.3			
	82	P55100021TW	使用狀態觀察器之直交流轉換器系統及其控制方法	中華民國	審查中	111108083			
	83	P55100021US	使用狀態觀察器之直交流轉換器系統及其控制方法	美國	審查中	17/719,789			
54	84	P55110004CN	直流-直流轉換裝置及其控制方法	中國大陸	審查中	202211563675.8			
	85	P55110004TW	直流-直流轉換裝置及其控制方法	中華民國	審查中	111144286			
55	86	P55110012TW	外轉子馬達	中華民國	審查中	111141766			
56	87	P55110013CN	並聯變頻泵控制裝置與並聯變頻泵控制方法	中國大陸	審查中	202211503576.0			
	88	P55110013TW	並聯變頻泵控制裝置與並聯變頻泵控制方法	中華民國	審查中	111144157			
57	89	P57100008EP	超音波萃取設備	EPC/歐盟	審查中	22212877.9			
	90	P57100008US	超音波萃取設備	美國	審查中	18/079,577			
58	91	P57110002TW	產生全局最佳運動策略的系統及其方法	中華民國	審查中	111142218			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
59	92	P57110003JP	用於農機雙核心冗餘控制系統	日本	審查中	2022-162193			
	93	P57110003TW	用於農機雙核心冗餘控制系統	中華民國	審查中	111134843			
60	94	P57110006TW	向上光照式廣角型光源裝置	中華民國	審查中	111147697			
61	95	P68090001CN	工具中心點的校正方法、機械手臂的教導方法及其系統	中國大陸	審查中	202110007956.4			
	96	P68090001US	工具中心點的校正方法、機械手臂的教導方法及應用其之機械手臂系統	美國	審查中	17/230,626			
62	97	P68090005US	去毛邊軌跡提取方法及其系統	美國	審查中	17/193,005			
63	98	P68090006US	調整支撐工件方法及可調式支撐工件系統	美國	審查中	17/225,633			
64	99	P68090007CN	加工路徑過切分析方法	中國大陸	審查中	202110123954.1			
	100	P68090007US	加工路徑過切分析方法	美國	審查中	17/179,093			
65	101	P68090008CN	用於工具機的加工監控方法及加工監控系統	中國大陸	審查中	202110043059.9			
	102	P68090008US	用於工具機的加工監控方法及加工監控系統	美國	審查中	17/241,479			
66	103	P68090009CN	機床快速移動加速度調整系統和方法	中國大陸	審查中	202110157126.X			
	104	P68090009US	工具機快送加速度調整系統和方法	美國	審查中	17/227,666			
67	105	P68090010CN	潤滑油量調整系統及潤滑油量調整方法	中國大陸	審查中	202110054696.6			
	106	P68090010US	潤滑油量調整系統及潤滑油量調整方法	美國	審查中	17/198,270			
68	107	P68090011TW	冷卻系統	中華民國	審查中	110102483			
	108	P68090011US	冷卻系統	美國	審查中	17/230,842			
69	109	P68090012CN	用於自動生成加工工藝特徵的處理方法及其系統	中國大陸	審查中	202110093648.8			
	110	P68090012US	用於自動生成加工製程特徵的處理方法及其系統	美國	審查中	17/170,312			
70	111	P68090013US	機械手臂校正系統及機械手臂校正系統方法	美國	審查中	17/219,890			
71	112	P68090014US	可動式機械的動作測試方法與控制主機	美國	獲證	17/169,560	US11378493	20220705	20410207
72	113	P68100001CN	主軸驅動裝置	中國大陸	審查中	202110452785.6			
	114	P68100001TW	主軸驅動裝置	中華民國	審查中	110114977			
73	115	P68100002CN	致動器	中國大陸	審查中	202110783090.6			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
	116	P68100002TW	致動器	中華民國	獲證	110122453	TWI763544	20220501	20410617
	117	P68100002US	致動器	美國	審查中	17/402,104			
74	118	P68100003CN	機械手臂的自動校正方法與系統	中國大陸	審查中	202110895517.1			
	119	P68100003TW	機械手臂與輪廓感測器座標系相對關係之自動校正方法與系統	中華民國	獲證	110124736	TWI762371	20220421	20410705
	120	P68100003US	機械手臂與輪廓感測器座標系相對關係之自動校正方法與系統	美國	審查中	17/573,922			
75	121	P68100004CN	熱影像輔助加工裝置、定位裝置及其方法	中國大陸	審查中	202210001421.0			
	122	P68100004TW	熱影像輔助加工裝置及其方法	中華民國	審查中	110130622			
	123	P68100004US	熱影像輔助加工裝置及其方法	美國	審查中	17/695,334			
76	124	P68100006CN	加工品質監控系統及其方法	中國大陸	審查中	202210001352.3			
	125	P68100006TW	加工品質監控系統及其方法	中華民國	審查中	110139286			
77	126	P68100009CN	加工路徑生成方法與系統及非易失性計算機可讀存儲介質	中國大陸	審查中	202111534093.2			
	127	P68100009TW	加工路徑生成方法、電腦程式產品與加工路徑生成系統	中華民國	審查中	110143060			
	128	P68100009US	加工路徑生成方法、電腦程式產品與加工路徑生成系統	美國	審查中	17/563,063			
78	129	P68100010CN	加工冷卻系統	中國大陸	審查中	202210004654.6			
	130	P68100010TW	加工冷卻系統	中華民國	審查中	110143047			
79	131	P68100011CN	用于工具機的校正方法及校正系統	中國大陸	審查中	202210067407.0			
	132	P68100011TW	用於工具機的校正方法及校正系統	中華民國	審查中	110148670			
	133	P68100011US	用於工具機的校正方法及校正系統	美國	審查中	17/719,133			
80	134	P68100013CN	加工路徑產生方法及裝置	中國大陸	審查中	202210230009.6			
	135	P68100013TW	加工路徑產生方法及裝置	中華民國	審查中	111104723			
	136	P68100013US	加工路徑產生方法及裝置	美國	審查中	17/710,684			
81	137	P68100014CN	工具機熱補償系統	中國大陸	審查中	202210014620.5			
	138	P68100014TW	工具機熱補償系統	中華民國	審查中	110146948			
	139	P68100014US	工具機熱補償系統	美國	審查中	17/684,666			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
82	140	P68100015CN	加工路徑的閃避方法及加工系統	中國大陸	審查中	202210223493.X			
	141	P68100015TW	加工路徑的閃避方法及加工系統	中華民國	審查中	111104462			
	142	P68100015US	加工路徑的閃避方法及加工系統	美國	審查中	17/704,038			
83	143	P68100016CN	調整機構、取放系統及其操作方法	中國大陸	審查中	202210053398.X			
	144	P68100016TW	調整機構、取放系統及其操作方法	中華民國	審查中	110147946			
	145	P68100016US	調整機構、取放系統及其操作方法	美國	審查中	17/694,464			
84	146	P68100017TW	用於自動控制設備之校正裝置與校正方法	中華民國	審查中	110145863			
85	147	P68110001CN	銑削刀具的設計方法及應用此設計方法形成的銑削刀具	中國大陸	審查中	202211429493.1			
	148	P68110001TW	自激式扭轉振動銑削方法和刀具	中華民國	審查中	111141802			
86	149	P68110002TW	複材刀具切削監控系統及其監控方法	中華民國	審查中	111126086			
	150	P68110002US	複材刀具切削監控系統及其監控方法	美國	審查中	17/975,418			
87	151	P68110003TW	適用於工具機之減速能量再利用的主動式電流補償系統	中華民國	審查中	111140209			
88	152	P68110004CN	懸浮磨料噴射流的加工方法及加工系統	中國大陸	審查中	202211337077.9			
	153	P68110004TW	懸浮磨料噴射流的加工方法及加工系統	中華民國	審查中	111139070			
	154	P68110004US	懸浮磨料噴射流的加工方法及加工系統	美國	審查中	18/070,634			
89	155	P68110005TW	超音波加工系統及方法	中華民國	審查中	111142253			
90	156	P68110006TW	熱溫升的刀具健康度評估方法	中華民國	審查中	111141419			
	157	P68110006US	熱溫升的刀具健康度評估方法	美國	審查中	18/080,859			
91	158	P68110007CN	水平關節機器手臂及其傳動機構	中國大陸	審查中	202211356312.7			
	159	P68110007TW	水平關節機器手臂及其傳動機構	中華民國	審查中	111138825			
92	160	P68110008TW	促進加工缺陷肇因分析的方法	中華民國	審查中	111143374			
93	161	P68110009TW	工具機診斷系統及診斷方法	中華民國	審查中	111148604			
94	162	P68110010TW	刀具加工負載監控方法	中華民國	審查中	111145855			
95	163	P68110011TW	自動收料系統及方法	中華民國	審查中	111147718			
96	164	P69100016US	紅外線元件及其製造方法	美國	審查中	17/993,942			

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
97	165	P69110001TW	電訊號還原系統及電訊號還原方法	中華民國	審查中	111147598			
98	166	P69110007TW	具橋接部的力量感測裝置	中華民國	審查中	111146554			
99	167	P69110010TW	氣體感測器	中華民國	審查中	111145946			
100	168	P70090015US	雷射檢測系統	美國	審查中	17/101,081			
101	169	P70100002TW	光束發射模組、光學測距系統以及光學掃描方法	中華民國	審查中	110148117			
	170	P70100002US	光束發射模組、光學測距系統以及光學掃描方法	美國	審查中	17/558,630			
102	171	P70100003US	光纖模組及其製法	美國	審查中	17/558,656			
103	172	P70100004CN	光電感測裝置、光電感測系統及其方法	中國大陸	審查中	202111545617.8			
	173	P70100004TW	光電感測裝置、光電感測系統及其方法	中華民國	審查中	110143830			

(五) 其他：8 案 11 件。

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	公告號	專利起期	專利迄期
1	1	P07080001CN	用臭氧降解除臭的方法與裝置	中國大陸	審查中	202010021942.3			
	2	P07080001TW	用臭氧降解除臭的方法與裝置	中華民國	獲證	109100691	TWI755672	20220221	20400108
2	3	P07090002US	氣體檢測裝置及氣體檢測方法	美國	獲證	16/953,493	US11243161	20220208	20401119
3	4	P51010183TW	半導體裝置及其製造方法	中華民國	獲證	102118253	TWI539572	20160621	20330522
	5	P51010183US	半導體裝置及其製造方法	美國	獲證	14/019,548	US9093312	20150728	20330905
4	6	P53110017TW	陶瓷電路板結構及功率模組	中華民國	審查中	111143728			
5	7	P53110034TW	奈米石墨烯壁、其製造方法、電極以及超級電容器	中華民國	審查中	111145730			
	8	P53110034US	奈米石墨烯壁、其製造方法、電極以及超級電容器	美國	審查中	18/071,524			
6	9	P55110007TW	鈣鈦礦厚膜、其製備方法以及包含其之輻射偵測器	中華民國	審查中	111147240			
7	10	P55110011TW	製造晶鈹的裝置	中華民國	審查中	111146941			
8	11	P55110015TW	離子化合物、吸收劑、及吸收裝置	中華民國	審查中	111148282			

【備註】：本標案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。